

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 18.08.2020

Ausstellungsdatum: 18.08.2020

Urkundeninhaber:

GIGAHERTZ Optik Vertriebsgesellschaft für technische Optik mbH
An der Kälberweide 12, 82299 Türkenfeld

Prüfungen in den Bereichen:

Optik

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Einschränkungen zum Prüfverfahren
Optik	CIE 220:2016	Characterization and Calibration Methods of UV Radiometers	Prüfung von Schmal- und Breitbandradiometer im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm
	ASTM G130-12	Standard Test Method for Calibration of Narrow- and Broad-Band Ultraviolet Radiometers Using a Spectroradiometer	
	CIE 202:2011	Spectral responsivity measurement of detectors, radiometers and photometers	

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-00

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Einschränkungen zum Prüfverfahren
	DIN 5031-11:2009-02	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik Teil 11: Radiometer zur Messung aktinischer Strahlungsgrößen- Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung	
Optik	ASTM G0138-12	Standard Test Method for Calibration of a Spectroradiometer Using a Standard Source of Irradiance	Spektralradiometer / Geräte-eigenschaften bei definierter Geräteeinstellung / Prüfung der spektralen Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm
Optik	CIE 063:1984	The Spectroradiometric Measurement of Light Sources	Prüfung der Bestrahlungsstärke von Strahlern, Leuchten und Halbleiterlichtquellen im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm
Optik	CIE 210:2014	Photometry Using V(λ)-Corrected Detectors as Reference and Transfer Standards	Beleuchtungsstärke / Lichtmessung Photometer
Optik	CIE 084:1989	The measurement of luminous flux	Lichtstrom von elektrisch betriebenen Strahlern / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken / Messung durch Integration der

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-00

Fachbereich	Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Einschränkungen zum Prüfverfahren
	DIN EN 13032-1:2012-06	Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten - Teil 1: Messung und Datenformat; Deutsche Fassung EN 13032-1:2004+A1:2012	Beleuchtungsstärkeverteilung
Optik	CIE 127:2007	Measurement of LEDs	Lichtstrom von LED / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken
Optik	CIE 063:1984	The Spectroradiometric Measurement of Light Sources	Spektraler Strahlungsfluss (Strahlungsleistung) im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1050 nm
Optik	CIE 063:1984 DIN EN 13032-1:2012-06	The Spectroradiometric Measurement of Light Sources Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten - Teil 1: Messung und Datenformat; Deutsche Fassung EN 13032-1:2004+A1:2012	Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 2500 nm

verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
CIE Commission Internationale de L'Eclairage